

XRR 解析レポート

プロジェクト

パス: 未保存

DBでの共有レベル: 共有

解析条件

波長(nm): 0.15403

点数: 1451

2 θ (°): 開始 = 0.200, 終了 = 6.000

ステップ = 0.004

オフセット = 0.000e+000

フィッティング手法: Nelder-Mead

データ間隔: 1点ごとにフィッティング

残差タイプ: $|\Delta(\text{LogI})|$

最大反復数: 500

許容誤差: 1.00e-015

装置関数: 擬Voigt関数

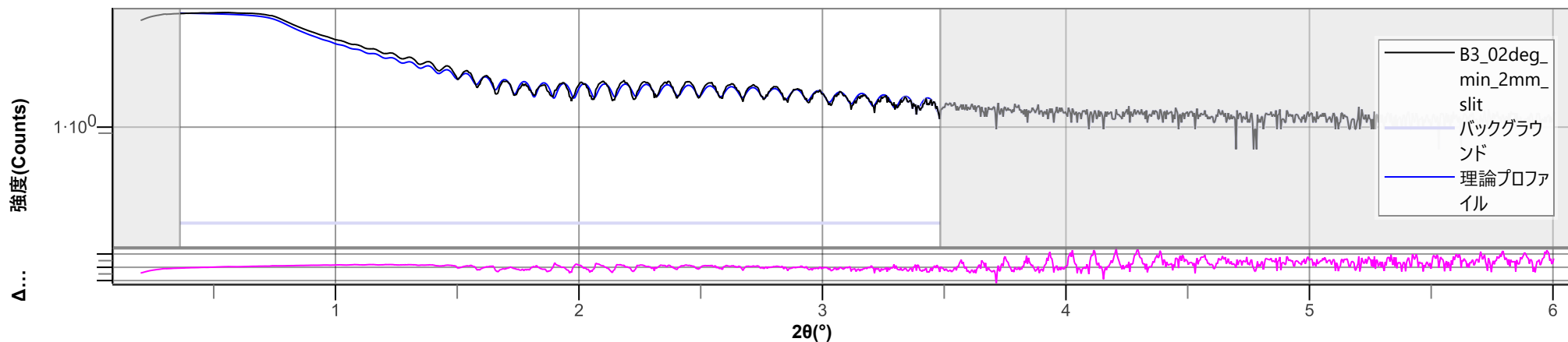
ローレンツ関数の比率: 0.00

ローレンツ幅: 1.00e-002

ガウス幅: 1.00e-002

結果

プロファイルプロット



	使用	層番号 ▼	材料	膜厚(nm) <th>	密度(g/cm³) <d>	粗さ(nm) <rg>	
	<input checked="" type="checkbox"/>	L4	Fe ₂ O ₃	0.875 Const ±0.018 精密化	2.59588 Const	0.100 Con...	
	<input checked="" type="checkbox"/>	L3	Fe ₂ O ₃	2.246 Const ±0.03 精密化	4.95000 Const	0.100 Con...	
	<input checked="" type="checkbox"/>	L2	Fe	93.578 Const ±0.04 →最大 精密化	7.86952 Const	0.641 Con...	
	<input checked="" type="checkbox"/>	L1	Fe	1.195 Const ±0.15 精密化	4.21695 Const	0.100 Con...	
	<input checked="" type="checkbox"/>	基板	Si	∞	2.32924 Const	0.500 Con...	